

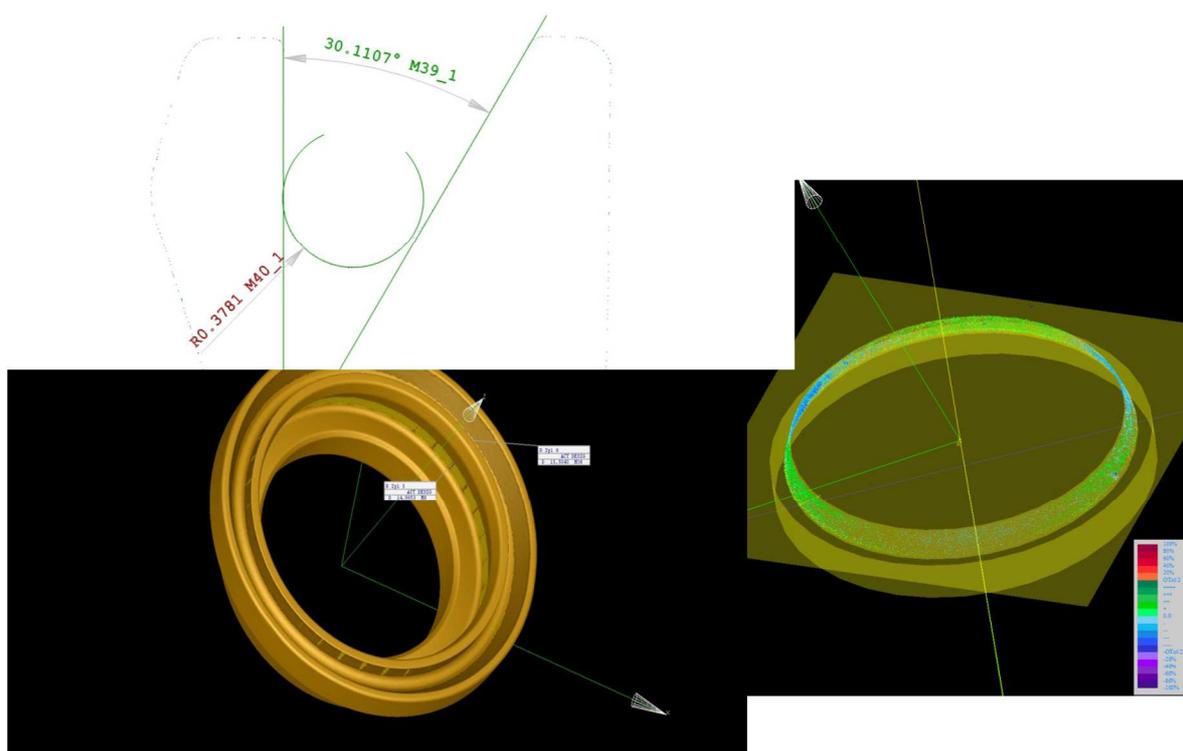


Tomografia Computerizzata applicata al controllo dimensionale e difettologia dei componenti

Seminario tecnico
Giovedì 13 ottobre 2016, ore 9:30-16.00
C/O Tecnelabor srl,
Via Panà 56/b - 35027 Noventa Padovana (PD)

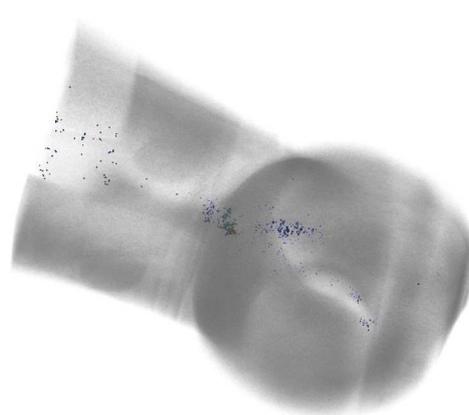
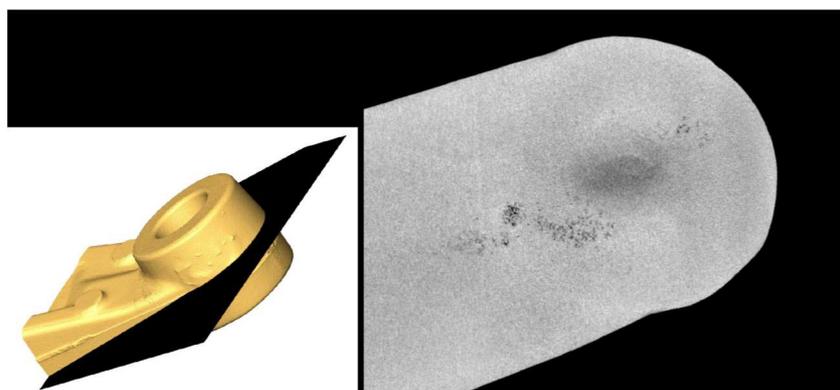
Relatore: Sig. Tristan Schubert - Product Manger X-Ray CT Werth Messtechnik GmbH

Moderatore: Ing. Sandro Telasi – Direttore Commerciale Werth Italia Srl



Programma

- Ore 9:30 Generalità sulla Werth Messtechnik
- Ore 9:45 Nascita e sviluppo della tomografia computerizzata alla Werth Messtechnik
- Ore 10:15 Raggi X: hardware
- Ore 11:00 Pausa caffè
- Ore 11:15 Concetti base della tomografia
- Ore 11:45 Misura dimensionale con tomografia computerizzata
- Ore 12:30 Pausa pranzo
- Ore 13:30 Tecnologia Werth per tomografia computerizzata
 1. Tomografia raster
 2. Tomografia a regione d'interesse (ROI)
 3. Tomografia Eccentrica
 4. Correzione delle distorsioni per componenti mono e multi-materiale
- Ore 14:30 Analisi difettosità dei materiali metallici, leghe leggere, polimeri ecc. presentazione di casi pratici e attraverso workstation e software Werth
- Ore 16:00 Termine dei lavori



MODULO DI ISCRIZIONE

Seminario sulla Tomografia Computerizzata

Giovedì 13 ottobre 2016, ore 9:30-16.00

C/O Tecnelabor srl,

Via Panà 56/b – 35027 Noventa Padovana (PD)

Per iscrizione:

www.amministrazione.it

(il seminario è completamente gratuito e i posti sono limitati)

Nome Cognome :

Azienda :

Mansione :

E-Mail :

Telefono :

